

## П'ЯТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ»

25–26 квітня 2006 р.

Київ, НТУУ «КПІ»

25–26 квітня 2006 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулася П'ята науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи». Метою конференції було спілкування фахівців з питань перспективних розробок, прецизійних технологій, нових рішень в приладобудуванні; зустріч з керівниками провідних підприємств, формування спільних проектів, пошук партнерів для співпраці.

Роботу конференції розпочали урочистою промовою заступник проректора з наукової роботи НТУУ «КПІ» **Воронов С. О.** та голова програмного комітету, декан приладобудівного факультету НТУУ «КПІ» **Тимчик Г. С.** На пленарному засіданні виступили науковці університету та гості з підприємств та організацій, діяльність яких пов'язана з приладобудівною галуззю. Серед гостей пленарного засідання конференції: **Лихоліт М. І.**, перший заступник генерального директора КП ЦКБ «Арсенал»; **Дашковський О. А.**, голова правління ЗАТ «Укрналіт»; **Міхєєва І. Л.**, **Орлов М. А.**, ЗАТ «Укрналіт»; **Крук І. С.**, заст. директора НАК «Нафтогаз України» ДК «Укртрансгаз» та ін.

В межах конференції на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю НТУУ «КПІ» працювала секція *«Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика»*. В роботі секції взяли участь більше тридцяти фахівців у галузі неруйнівного контролю з різних міст

України. На пленарному засіданні від секції виступив головний конструктор ВО «Київприлад» **Кульбачний В. П.**

Доповідачі у своїх виступах висвітлювали такі актуальні в наш час питання, як діагностика стану високовольтних ізоляторів під напругою (Серебренніков С. В., Сіріков О. І., Кротовський В. П., НТУ, м. Кіровоград), дослідження розвитку мікротріщин у напружено-деформованих конструкціях (Чеховський С. А., Габльовська Н. Я., ІВНТУ, м. Івано-Франківськ), вплив факторів оточуючого середовища на проведення теплого контролю енергообладнання (Петрик В. Ф., Юрченко Г. С., НТУУ «КПІ», м. Київ), тепловізійна діагностика електронних вузлів телекомунікаційної апаратури (Стороженко В. А., Малик С. Б., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків) та багато інших.

Значну частину доповідей надали науковці НТУУ «КПІ», в тому числі викладачі, студенти і магістранти кафедри приладів та систем неруйнівного контролю. Своє бачення проблем неруйнівного контролю, технічної та медичної діагностики, а також можливі шляхи їх вирішення представили старший викладач кафедри **Лігоміна С. М.** та асистент **Галаган Р. М.**, а також студенти IV–VI курсів.

*Оркомітет конференції*